### **OPTICAL DETECTOR**

Patent number:

JP63000830

Publication date:

1988-01-05

Inventor:

KUDO TOSHIYUKI; others: 02

Applicant:

SANYO ELECTRIC CO LTD

**Classification:** 

- international:

G11B7/13; G02B3/00

- european:

Application number:

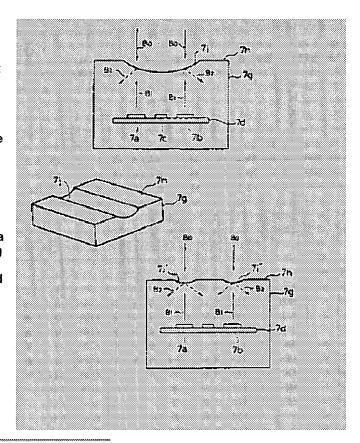
JP19870147499 19870612

Priority number(s):

#### Abstract of JP63000830

PURPOSE:To reduce the quantity of return light beams returned from the inside of a resin surface to a light receiving element side, by forming a recessed part, or a projecting part at a part confronting with the light receiving element, on the resin surface of the light receiving element on which resin molding is applied.

CONSTITUTION:On the light receiving surface of a mold resin 7g confronting with light receiving elements 7a, 7b, and 7c, a circular recessed part 7i is formed. In this case, it is possible to form a linear recessed part 7i instead of the recessed part 7i, and to form circular recessed parts 7i', and 7i'' respectively on the surface confronted with the elements 7a and 7b, and furthermore, to form the projecting part instead of the recessed parts 7i, 7i'.... In this way, reflected light beams B1 are changed to scattered light beams B2 by the recessed parts 7i..., and the return light beams to the elements 7a... can be reduced, and interference between incident light beams B0 and the light B2 can be reduced. Therefore, it is possible to keep balance in light quantities between tracking elements, and to reduce the temperature change of a tracking error signal, and to perform a stable tracking operation.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(IP)

⑩ 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭63-830

@Int Cl. 4

證別配号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)1月5日

7/13 3/00 G 11 B G 02 B

7247-5D Z-7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**公発明の名称** 光検出器

> ②特 昭62-147499 願

❷出 昭60(1985)2月12日

前実用新案出頭日援用

勿発 明 者 工 嫠 73発 明 者 浜

敏 行 律 雄 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

73発 明 者 伊藤 夫 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

の出 顔 人 三洋電機株式会社 少代 理 弁理士 西野 卓嗣

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

外1名

- 1. 発明の名称 83 検
- 2. 特許請求の範囲

い 受光素子を樹脂モールドした光検出器であ って、前記受光素子と対向する部分のモールド樹 脂受光装面に対して、凹部又は凸部が形成されて いることを特徴とする光検出器の

- 3. 希明の詳細な説明
  - (イ) 産業上の利用分野

本発明は記録媒体に情報を光学的に記録若しく は配録媒体に記録された情報を光学的に再生する 光学へッドに適用される光検出器に関する。

四 従来の技術

ディスク状配録媒体に記録された情報を光学的 に再生する装質は公知であり、これらの装盤には レーザを光顔とする光学へッドが適用される。現 5 図は一般的な光学へっド装置の例を示すもので、 Oは半導体レーザ、Dは自折格子、Gはハーフブ リズム、40は対物レンズ、は1は凹レンズ、(6)はシ リンドリカルレンズ、イプは光検出器である。尚、

(Aはディスクである。この例はトラッキング制御 方式がるビーム方式となっており、光微出器门に 形成された一対のトラッキング角受光器子(7a } ( 7 b ) によりトラッキングエラー信号が役出 される。又、フォーカス研阅方式は非点収差方式 となっており、4分割受光常子(7c)によりフ ★ーカスエラー信号が後出される。情報(RF) 償母は、4分割受光業子(7C)により検出され

さて、このような光学へっドには、受光ポ子を 樹脂、例えば透明のエポキシ樹脂をモールドした 型の光検出器(7)が使用されるが、この構造は第6 図(a)(b)に示す如く、基板(7d)上に形 成した受光索子(7a)、(7b)、(7c)と、 放送受益子からの出力を導出するリード級(78 )と、外部出力端子(71)の一部が透明樹間( 7g)中にりめ込まれた構造をなしている。内敵 された機能部はモールド樹脂のほぼ中心部に配置 され、受光素子褒的(7 a')(7 b')(7 c')と 樹脂の食光袋面(7h)とは平行になる如く構成

されている。

2つのトラッキング用受光累子(7a)(7D )からの出力(電流)は吊7図に示すトラッキン グ信号処理回路により選圧に変換される。トラッ キングエラー信号は放算四路(A2)で受光器子 (7a)(7b)の倍弓が放算されて得られ、受 光銀子(7a)(70)からの出力(増幅後の出 力しをSa、Sbとすると、トラッキングエラー 信号成分(TE)はTE=SD-Saとなる~ (A0)(A1)は増幅器であるn 第8図(A) はSa、Soの出力波形、弗8図(b)はトラッ キングエリー信号の波形を示す。流常、TB信号 の中間点(P-P値のな)は光学系の条件、Sa、 SbのDCレベルや出力レベルの相違があって、 GNDレペルと一致しない場合があり、この中間 点のずれを回路的に補正するため、抵抗しR4) 又は(Rt)、若しくは(Rs)又は(Rs)を 可変することによって該中間点をG N D レベルに 一致させる調整を行なりnしかし、数中間点がG NDレベルとすれた場合、トラッキングサーポは

象で変化することが分かった。 第9 図(り)で、例えば、初期(常温)で調整された場合は、当然のことながらなは Q(GNDレベル化中間点が一致して△ェは O である)であるが、常温(To)より 1 O ~ I 5 で高温ではなはピークに達する。従って、 なが 1 0 %を越えた温度ではトラッキング動作が不安定になりやすい。

この原因は光学系における光の相互干渉における光の相互干渉においる光の相互によるものであり、温度変化光器にいるとの発生によるものであり、特に光をといると変化率の70~80%を占めいいるとの現象は第10回をでは、全変化率の現象は第10回を示すとの現象は第10回をでは、カッカング用ビーム光(B面(7h)の形とし、トラッキング用受光素子(7h)の一般によったが明要を通りのとし、トラッキング用受光素子(7h)のでし、トラッキング用受光素子(7h)のでし、トラッキング用受光素子(7h)のでし、トラッキング用受光素子(7h)のでし、トラッキング用受光素子(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を面(7h)のでし、トラッキング用受光素を回りに対象のでは、100回には、10

GNDレベルになる様に作動しようとするため、一定量以上のずれがあるときはトラッキング方向にオフセットをもつことになり、サーボが動作しなくなるという状況になる。さて、上述の従来の光学へッドでは、トラッキングエラー信号が温度変化で変動し、サーボ回路の制御可能領域をこえ

る場合がしばしば発生し、トラッキング動作が不

安定になる欠点があった。

第9図(a)はトラッキングエフー信号の温度 変化を示すもので、初期(常品)の調整されたトラッキングエフー信号(TE)は温度Tの変化により変動し、ある温度では(TE)の様代でれてゆくのここで、トラッキングエフー信号の振察化学へは、変化をは、変化をは、変化をは、変化をは、変化をは、変化をは、変化をないが、などをないが、などをないである。の温度等性を示したもので、なが最大15~20%に達する場合があり、しかも一定の温度質の混度差でなりなり現

ームの透過効率を上げるために鏡面に仕上げされ ており、入射ビーム(Ba)は受光素子(7a) に当った光量の一部が受光索子(7a)の表面で 反射されて反射光(81)となる成分がある。 と の反射光(B1)はさらに流徹状を呈したモール ド樹脂表面(7h)で反射されて反射光(82) となり、再び受光器子(7a)上に当る。常温し 初期)では、との様な状態で一定の光量が得られ る様に調整される。ところが、温度変化がある場 合、例えば雰囲気温度が常温より上昇すると、モ ールド樹脂は点場で示す状態に態膜する。常温し 初期)における受光常子(7m)とモールド樹脈 **受光表面し 7 h ) との距離をしとすると、ある温** 度上昇ではその距離は し+ △ とし △ とは温度差に よる変化量)となり、初期の場合に比べて光路差 が生じた状態となる。一般で波投入の2つの光源 ではメノ2の光路差が生じた場合は光の干渉によ る光の明暗が発生することは良く知られている。 即ち、この機な光路差を生じる条件では入射光し Bo)と反射光(B2)が受光素子(7a)上で

△ & 中 ( 2 四 + 1 ) 1 / 2 ( ととで四は整数 ) と なる場合に相互干渉を起丁ととになる。例えば、 モールド樹脂としてエポキシ樹脂を使用した場合、 4-600×m、エポキシ樹脂の膨脹係数を5.2 × 10<sup>-5</sup>/セ、 レーザ光像の波長を800カロ とすると、干渉が発生する条件、即ち光路整が入 /2になる温暖差は約13cとなる。 この事は第 9 図( D ) 化示寸実測値と抵俘合致することで表 付けされている。この様を、光の干渉では受光素 子(7a)上で光の明るさの変勢をきたし、光粒 が変わるととになる。例えば、受光呆子(78) のみで光の干渉を生じたとき(受光常子(70) では干渉は生じない場合)、箱果的に(7b)で は一定(初期と同じ光鷺)であるが、受光素子( 7 a )では光量が変動するため、受光素子( 7 a )(70)で光量度が発生し、従ってトラッキン グェッー信号がGND レベルに対してアンバラン スとなる。尚、条件によってはトラッキングエラ 一僧号の変動にパラツキがあり、通常変化率のは 2~3%から15~20%の範囲にあるっ

の光の明るさの変動を減じることができる。

#### 20 実施例

以下、本発明に関し、実施例を図面に基づいて 説明する。親1図は第一の実施例を示すものであ り、受光素子(7a、7b、7c)に対向するモ ールド徴脈(7g)の受光表面に円形の凹部(7 1)を形成した例である。反射光(B1)に前配 凹部(71)により散乱光(B2)となり、受光 素子(7a、7b、7c)への戻り光は軽減され る為、入射光(Bo)と戻り光(B2)の干渉は 軽減される。

第2 図は第2 の実施例を示すものであり、凹部 に替えて直線状の凹部(7j)を形成した例である。この凹部(7j)の方向は第1 図心の X 方向、Y 方向の何れであっても良い。

第3節は第三の実施例を示すものであり、トラッキング用受光素子(7a、7b)に対向する要面に夫々円形の凹部(7i')(7i')を形成した例である。

**粛4 図は雰辺の実施例を示すものであり、円形** 

従来の欠点を解消する為、例えば実開昭56-157762号でモールド樹脂表面に光反射機を 設ける提案が開示されているが、無機材料からな る反射機とモールド樹脂材との密磨性に乏しく、 且つ反射機形成時の高温処理でモールド樹脂が変 質(透過器が劣下)する欠点があった。

### 17 発明が解決しよりとする問題点

本発明の目的とするところは、上記の点に鑑み てなされたもので、トラッキングエラー信号の温 度変化を減少する光検出器の提供にある。

#### 臼 問題点を解決する為の手段

本発明では、光検出器内に於けるレーザ光による光の相互干渉を軽減する為に、樹根モールドの 受光表面のりち、受光素子に対向する部分に対し て凹部又は凸部を形成したものである。

#### 州 作 用

受光案子の受光面にて反射された反射光は、上述した凹部又は凸部により散乱される為、再び受光案子側に戻る戻り光が著しく少なくなり、入射光との相互干渉が軽減され、以って受光素子上で

凹部 ( 7 i') ( 7 i') に替えて直線状の凹部 ( 7 j') ( 7 j') を形成した例である。 この場合の凹部の方向は、第3図(D)の X 方向とする。

上記実施例は全て凹部を形成した例であったが 凹部に替えて凸部としても良い。

凹部の深さ、凸部の高さは、50~100 ▲ ■ 位が適当である。深さ又は高さを大きくして曲率 が小さくなると、これ等凹部又は凸部がレンズ効 果を果すこととなり、受光素子上で、有効を光ピ ーム径を得ることができなくなる。

円形の凹凸部の場合、1 例の場合は直径 5 0 0 ~ 8 0 0 m m、2 例の場合は直径 1 5 0 ~ 1 7 0 m 程度が適当である。直線状の凹凸部の場合、1 例の場合は幅 5 0 0 ~ 8 0 0 m m、2 例の場合は1 5 0 ~ 1 7 0 m m が適当である。

#### (ト) 発明の効果

以上述べた本発明に依れば、受光条子に対向し た部分のモールド樹脂受光表面に対して、四部又 は凸部が形成されたものであるから、受光案子に て反射され頃にモールド樹脂受光表面の内側にて 反射されて再び受光素子に向う戻り光は散乱され る為、受光素子に向う入射ピーム光と戻り光との 干砂を防止するととができる。依って、例えば、 光学式のピックアップ装置に採用した場合、二つ のトラッキング用受光常子の光量パランスが維持 され、以ってトラッキングエラー信号の温度変化 を少なくでき、安定なトラッキング動作を行りと とができる。

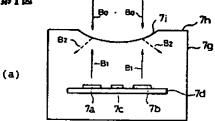
### 4. 図面の簡単な説明

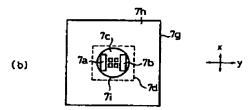
第1図(a)(b)は本発明の第一の実施例を 示すものであり、(a)は正面図、(b)は平面 函、第2図は第二の実施例を示す斜視図、第3図 ( & ) ( b ) は第三の実施例を示す図であり、( 8.) は正面図、(b)は平面図、第4.図は毎四の 実施例を示す斜視図、第5図は一般的を光学へっ ドを示す図、第6図は従来の光検出器を示す図、 **棋7図はトフッキング信号処理回路を示す図、零** 8 図( & )( D )は第7 関に示す回路の動作波形 図、第9函はトフッキングエラー信号の温度特性 図、第10図は光干歩の発生状況の説明に供する

凶である。

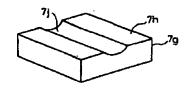
1714 光検出省、( 7 a 、 7 b 、 7 C ) は受光素 子、(18)は樹稲モールド、(1h)はモール ド樹斯の受光表面、(71、71、71)は円形 四部、(7j、7j、7j、)红直极状凹部。

> 出國人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 酉 野 卓 扇 (外1名)

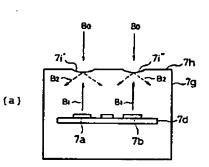


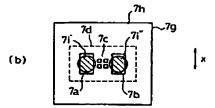


第2図

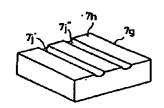


第3図

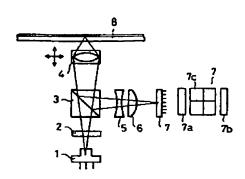




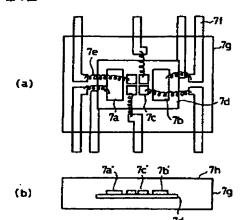
第4因



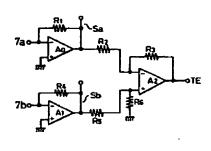
第5図



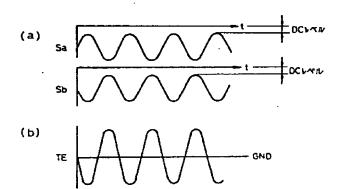
## 第6図



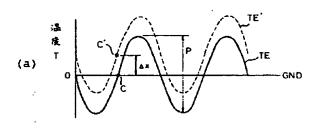
## 第7図

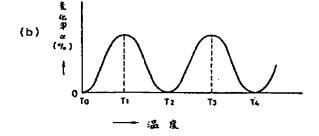


# 第8図



## 第9図





## 図01葉

